공동기기원 장비사용 요금표

-미세구조분석실- 2023. 11. 16. 기준

※ Data처리 시간은 분석 시간에 포함(분석시간 1시간은 50분 기준)
※ 예약취소: 예약일로부터 3일 이내에 취소하는 경우 예약시간에 해당하는 사용료의 50%가 부과됩니다.
※ 급행분석: 기존 예약일정과 무관하게 긴급히 분석을 요청하는 경우 사용금액 50%가 추가 부과됩니다.(담당자협의 필요)

장 비 명	구 분	항 목	분석료(원)		
			단 위	교 내	교 외
TEM1 (JEM3010) 투과전자현미경	기본료		1시간	100,000	160,000
	EDS(추가)		1시간	30,000	60,000
TEM2 (JEM2100F) 전계방출 투과전자현미경	영상분석		1시간	140,000	210,000
	EDS(추가)		1시간	40,000	80,000
TEM3 (ARM200F) 수차보정 투과전자현미경	영상분석		1시간	200,000	300,000
	EDS(추가)		1시간	60,000	120,000
	EELS(추가)		1시간	80,000	160,000
TEM4 (JEM-F200) 전계방출 투과전자현미경	영상분석		1시간	200,000	300,000
	EDS(추가)		1시간	80,000	160,000
전처리	액체질소		시료	2,000	4,000
	Epoxy Molding		시료	10,000	20,000
	Epoxy Molding + Polishing		시료	100,000	100,000
	Ion Beam Miller		10분	4,000	8,000
	Jet Polisher		시료	20,000	40,000
	Ultramicrotome	SEM 시료	시료	100,000	100,000
		TEM 시료	시료	300,000	300,000
	Cryo Ultramicrotome	SEM 시료	시료	150,000	150,000
		TEM 시료	시료	600,000	600,000
	Powder		시료	5,000	5,000
	박막		시료	300,000	300,000
	Grid	continuous carbon	1개	15,000	15,000
		carbon holey	1개	25,000	25,000
	이온빔단면가공 (Cross section polisher, CP)	Epoxy Molding	시료	30,000	60,000
		기본	2시간	60,000	120,000
			4시간	100,000	200,000
		시간추가(4시간 초과)	1시간	20,000	40,000
	Laser Cutting	PCB가공	시료	100,000	140,000
		커팅	시료	20,000	30,000

장 비 명		구 분	항 목	분석료(원)		
				단 위	교 내	교 외
FIB	Ⅰ (SMI3050TB)	단면분석	기본	1시간	150,000	220,000
	Ⅱ (JIB-4601F)	단면분석	기본	1시간	160,000	240,000
	Ⅲ (NX2000)	단면분석	기본	1시간	170,000	250,000
	Ⅳ (Helios 5)	단면분석	기본	1시간	170,000	250,000
	공통	DATA	Image	1장	2,000	3,000
		EDS	Point	시료	35,000	50,000
			line profile /mapping	시료	40,000	60,000
		TEM sample preparation	기본	시료(2시간)	360,000	500,000
		Grid	Mo	1개	50,000	50,000
SEM	Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ	영상분석	기본	1시간	80,000	110,000
			시간추가	1시간	60,000	90,000
		EDS	Point	시료	35,000	50,000
			line profile /mapping	시료	40,000	60,000
		EBSD	기본	1회	40,000	60,000
	Ⅴ,Ⅵ	영상분석	기본	1시간	120,000	160,000
			시간추가	1시간	100,000	140,000
		EDS	Point	시료	50,000	70,000
			line profile /mapping	시료	60,000	80,000
		EBSD	기본	1회	60,000	80,000
	공통	Coating	Pt(일반)	1회	15,000	20,000
			Pt(고급)	1회	30,000	40,000
			Ir	1회	50,000	60,000
		DATA	Image	1장	2,000	3,000
Nano indenter (나노경도측정기)		기본		1시간	60,000	120,000

장 비 명		구 분	항 목	분석료(원)		
				단 위	교 내	교 외
Cryo-system	Cryo-TEM1 (300kV)	스크리닝	기본	1일	1,400,000	2,000,000
		데이터 수집	기본	1일	1,050,000	1,500,000
		일회성 실험	기본	1시간	210,000	300,000
	Cryo-TEM2 (200kV)	스크리닝	기본	1일	1,050,000	1,500,000
		데이터 수집	기본	1일	840,000	1,200,000
		일회성 실험	기본	1시간	150,000	200,000
	Cryo-FIB	시편 제작*	기본	1시간	150,000	200,000
	Vitrobot	시편 제작*	기본	1개	50,000	50,000

* Cryo-FIB 및 Vitrobot 시편용 그리드 미포함